

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro

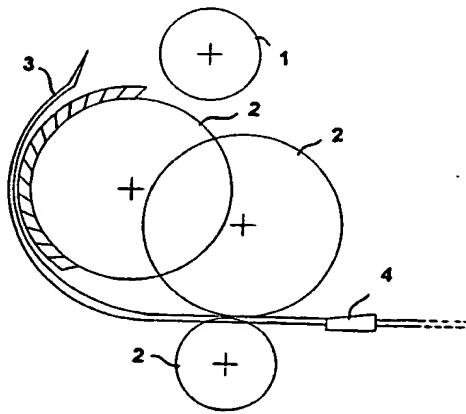


INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : G07D 7/12, 7/02	A3	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/49655
		(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 5. November 1998 (05.11.98)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/01182		(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
(22) Internationales Anmeldedatum: 24. April 1998 (24.04.98)		
(30) Prioritätsdaten: 197 18 916.4 25. April 1997 (25.04.97) DE		
(71) Anmelder (<i>für alle Bestimmungsstaaten ausser US</i>): WHD ELEKTRONISCHE PRÜFTECHNIK GMBH [DE/DE]; In- dustriestrasse 19, D-01129 Dresden (DE).		
(72) Erfinder; und		Veröffentlicht
(75) Erfinder/Anmelder (<i>nur für US</i>): PUTTKAMMER, Frank [DE/DE]; Kastanienstrasse 19, D-01640 Coswig (DE).		<i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>
(74) Anwalt: HEITSCH, Wolfgang; Göhlsdorfer Strasse 25g. D-14778 Jeserig (DE).		(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchen- richts: 4. Februar 1999 (04.02.99)

(54) Title: APPLICATION AND METHOD FOR CHECKING DOCUMENTS WITH EFFECTIVE OPTICAL DIFFRACTION SECURITY LAYER

(54) Bezeichnung: ANWENDUNG UND VERFAHREN ZUR PRÜFUNG VON DOKUMENTEN MIT BEUGUNGSOPTISCH WIRK-
SAMEN SICHERHEITSSCHICHTEN



(57) Abstract

The invention relates to an application and a method for checking documents. Hitherto, documents with optical diffraction security layers, specially holograms, were checked by costly optical monitoring technology. The entire monitoring process was so time-consuming that the monitoring process could not be applied to fast operating processing machines. Rapid monitoring (as an authentication characteristic) constitutes a further security step in evaluating effective optical diffraction security layers. The effective optical diffraction layer has a discontinuous metallizing layer and/or partially metal layers and/or areas of metal layers on various planes. Several methods of measurement exist to detect electrical conductivity. In practice, the contactless capacitive method of measurement has proven to be more practical.